



NIS colloquium – IBATO6

“Advanced Applications in Scanning Probe Microscopy”

Monday, July 15th 2013

Centre of excellence NIS

Centro dell’Innovazione dell’Università, Via G. Quarello 15, Torino

Organizers: E. Bernardi, E. Vittone

PROGRAM

09 ³⁰	Silvia Bordiga - Dip. di Chimica and NIS, Università di Torino, <i>Introduction</i>
09 ⁴⁵	Federico Cesano - Dip. di Chimica and NIS, Università di Torino, <i>Advances in SPM methods for morphology and electrical properties</i>
10 ¹⁵	Alessia Demichelis - Istituto nazionale di Ricerca Metrologica, <i>Metrological approach to the AFM Force Spectroscopy method for elastic modulus</i>
10 ⁴⁵	Coffe break
11 ¹⁵	Gian Bartolo Picotto - Istituto nazionale di Ricerca Metrologica, <i>AFM metrology of nanoparticles</i>
11 ⁴⁵	Francesco Orsini - Dip. di Fisica, Università di Milano, <i>Synthesis and characterization of native biological membranes</i>
12 ¹⁵	Giuliano Casati - G.Gambetti Kenologia srl, <i>Presentation of AFM PARK NX 10</i>
12 ⁴⁵	Lunch
14 ¹⁵	Ettore Bernardi - Dip. di Fisica and NIS, Università di Torino <i>Electrical properties of buried graphite channel probed by Electrical Force Microscopy technique</i>
14 ⁴⁵	Federica Celegato - Istituto nazionale di Ricerca Metrologica <i>Imaging Magnetic Domain Patterns by Magnetic Force Microscopy technique</i>
15 ¹⁵	Riccardo Tagliapietra – Renishaw S.p.A <i>Raman AFM : Introduction and current applications</i>
15 ⁴⁵	Coffe break
16 ¹⁵	Visit at NIS laboratories